07

Генерация СВЧ-импульсов монолитными трехпереходными AlGaAs/GaAs p-i-n фотопреобразователями и модулями без обратного смещения

© В.С. Калиновский, Е.В. Контрош, И.А. Толкачев, К.К. Прудченко, В.С. Юферев, С.В. Иванов

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия E-mail: vitak.sopt@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 25 октября 2024 г. В окончательной редакции 13 января 2025 г. Принято к публикации 13 января 2025 г.

Продемонстрирована возможность генерации СВЧ-импульсов в фотовольтаическом режиме монолитными трехпереходными p-i-n AlGaAs/GaAs фотопреобразователями (ФП) лазерного излучения, выращенными методом молекулярно-пучковой эпитаксии. В монолитных трехпереходных p-i-n AlGaAs/GaAs ФП достигнуто существенное увеличение выходной пиковой импульсной мощности и быстродействия в субнаносекундном диапазоне по сравнению с однопереходным p-i-n ФП. При вводе из оптоволокна импульсного лазерного излучения на длине волны 850 nm с пиковой мощностью <5 W и длительностью на полувысоте амплитуды $\tau_{0.5}=140$ рs получены импульсы фотоответа с амплитудой $U_{\rm max}=2.7$ V, пиковой мощностью $P_{peak}=21.6$ dBm и длительностью $\tau_{0.5}\leqslant750$ рs. Модуль из двух ФП, включенных последовательно, обеспечил на выходе импульсы с амплитудой $U_{\rm max}=3.4$ V, мощностью $P_{peak}=23.7$ dBm и длительностью $\tau_{0.5}\leqslant420$ рs. Показано, что модуль из четырех монолитных трехпереходных ФП способен формировать биполярный СВЧ-импульс с параметрами $U_{\rm max}=6.4$ V, $P_{peak}=29.1$ dBm, $\tau_{0.5}\leqslant1$ ns с полосой пропускания до 1.4 GHz и основной несущей частотой ~0.8 GHz. Проведенное численное моделирование показало достаточно хорошее соответствие между измеренными и расчетными формами импульсов фотоответа данных ФП.

Ключевые слова: монолитный трехпереходный фотопреобразователь, p-i-n AlGaAs/GaAs фотопреобразователь, генерация СВЧ-импульсов, молекулярно-пучковая эпитаксия, импульсное лазерное излучение, длительность на полувысоте амплитуды, оптоволокно, пиковая мощность.

DOI: 10.61011/PJTF.2025.09.60228.20169

В настоящее время на смену традиционной радиоэлектронике приходит новая радиофотонная компонентная база, где одними из важнейших элементов, например, в радиофотонных активных фазированных антенных решетках (РОФАР) [1] являются мощные импульсные фотопреобразователи (ФП). Эффективность РОФАР во многом определяется выходной электрической мощностью ФП, быстродействием, согласованием с нагрузкой (антенной), а также энергонезависимостью, обеспечивающей полную гальваническую развязку между антенной решеткой и основной генерирующей аппаратурой. Для этого ФП должны генерировать СВЧ-импульсы максимальной мощности в фотовольтаическом режиме, т.е. без подачи обратного напряжения смещения. Небольшая (до 1 km) длина волоконно-оптических линий связи радиофотонных систем позволяет работать без значительных потерь в спектральном диапазоне 700-900 nm, где высоким КПД обладают GaAs/AlGaAs ФП.

В различных типах структур ФП, к которым относятся p-i-n ФП [2], ФП с частично обедненным поглотителем (PD) [3], униполярные ФП (UTC) [4], модифицированные униполярные ФП (MUTC) [5], ключевой особенностью является наличие нелегированного (p-i-n, PD и UTC ФП) или слаболегированного (MUTC) i-слоя микронной толщины. Основной массив

исследований и разработок посвящен фотодиодам, работающим в диодном режиме (при обратном напряжении смещения), и ориентирован на преобразование лазерного излучения на длине волны $\lambda = 1550\,\mathrm{nm}$. В работе [6] показано, что в MUTC InGaAsP/InP ФП с диаметром фотоактивной поверхности ≤ 50 µm при напряжениях смещения $\leq 44 \, \mathrm{V} \ (\lambda = 1550 \, \mathrm{nm})$ достигнуты значения выходной пиковой мощности $\leq 44.2\,\mathrm{dBm}$ с амплитудой $U_{\rm max} < 38 \, {
m V}$ и длительностью на полувысоте амплитуды $au_{0.5} \sim 30 \, \mathrm{ps. \ B} \ [6]$ приведены характеристики быстродействующих MUTC GaAs/AlGaAs ФП с чувствительностью $\sim 0.5\,\text{A/W}$ и квантовой эффективностью до 73 % в гигагерцевом диапазоне на длине волны 850 nm при нулевом смещении, что обеспечило получение выходных электрических импульсов с милливаттной (< 10 dBm) пиковой мощностью.

Настоящая работа посвящена разработке и исследованию характеристик субнаносекундных мощных монолитных трехпереходных p-i-n AlGaAs/GaAs $\Phi\Pi$ (ТП $\Phi\Pi$) лазерного излучения (830-860 nm), работающих в фотовольтаическом режиме.

Указанные ФП были выращены методом молекулярнопучковой эпитаксии (МПЭ) на подложке n-GaAs ($N_D\sim 3\cdot 10^{18}~{\rm cm}^{-3}$). Структура ТП ФП (рис. 1, a) включала в себя три p-i-n GaAs субэлемента с толщинами

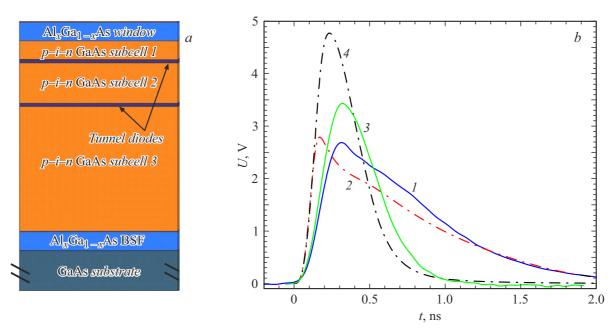


Рис. 1. a — структура монолитного трехпереходного p-i-n AlGaAs/GaAs ФП. Цифрами обозначены верхний (1), средний (2) и нижний (3) p-i-n GaAs субэлементы, соединенные $n^{++}-p^{++}$ GaAs туннельными диодами; b — импульсы фотоответа монолитного p-i-n ТП ФП (1 — эксперимент, 2 — расчет) и модуля из двух последовательно включенных ТП ФП (3 — эксперимент, 4 — расчет) при мощности лазерного излучения 4.7 W и длительности 140 ps.

верхнего, среднего и нижнего переходов, выбранными из условия равенства фототоков, генерируемых в субэлементах [7]. Уровни легирования составляли для р-слоев $N_A \geq 1 \cdot 10^{18} \, \mathrm{cm}^{-3}$, для n-слоев $N_D \leq 1 \cdot 10^{18} \, \mathrm{cm}^{-3}$ и для i-слоев $N_D \sim 1 \cdot 10^{15} \, {\rm cm}^{-3}$. В качестве соединительных элементов между фотоактивными p-i-n-переходами использовались встречно включенные наноразмерные GaAs p^{++} – n^{++} туннельные диоды, каждый с суммарной толщиной ≤ 30 nm. Структура также включала широкозонное окно $p\text{-Al}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{As}$ ($N_A \sim 5 \cdot 10^{19}\,\text{cm}^{-3}$ — $0.3\,\mu{\rm m})$ и тыльный потенциальный барьер $n\text{-Al}_{0.2}{
m Ga}_{0.8}{
m As}$ $(N_D \sim 3 \cdot 10^{18} \, {\rm cm}^{-3} \, - \, 0.2 \, \mu {\rm m})$. Постростовым процессированием с использованием планарной технологии были сформированы чипы ФП с фоточувствительной поверхностью диаметром 250 μm, кольцевым сетчатым фронтальным контактом (Ag(Mn)/Ni/Au) толщиной $h \sim 3600 \,\mathrm{A}$ и тыльным контактом (Au(Ge)/Ni/Au) толщиной $h \sim 2000$ Å. Пассивация боковой поверхности меза-структуры выполнялась слоем диэлектрика Si₃N₄.

Исследованные ТП ФП имели максимумы внешней квантовой эффективности $Q_{ext} \ge 21\,\%$ на длинах волн $850-860\,\mathrm{nm}$ (без учета затенения фронтальной контактной сеткой и коэффициента отражения $< 10\,\%$).

Для согласования с $50\,\Omega$ нагрузкой и улучшения теплоотвода $\Phi\Pi$ монтировались методом вакуумной пайки на симметричную микрополосковую линию на основе AlN. Разварка контактов осуществлялась $50\,\mu$ m золотой проволокой с минимизацией значения индуктивности. Были изготовлены СВЧ-модули, состоящие из двух и четырех ТП $\Phi\Pi$, смонтированных на микрополосковых теплоотводящих основаниях AlN. Импульсное лазерное

возбуждение как отдельных ТП Φ П, так и в модуле осуществлялось соответственно многомодовым оптоволокном и разветвителями 1/2 с выходными диаметрами 50 μ m.

Исследования характеристик быстродействия для отдельных монолитных ТП ФП и модулей на их основе проводились при возбуждении импульсным лазером на длине волны 850 nm с длительностью на полувысоте амплитуды $au_{0.5} = 140 \, \mathrm{ps}$, частотой следования 1 kHz и выходной пиковой мощностью до 5 W. Для расчета фотоотклика ФП использовались нестационарные диффузионно-дрейфовые уравнения переноса носителей заряда совместно с уравнением Пуассона для потенциала. Рассматривался процесс межзонного туннелирования, который учитывался посредством введения дополнительного рекомбинационного члена в уравнения переноса при использовании нелокальной модели [7]. Учитывались рекомбинация Шокли-Рида-Холла и излучательная рекомбинация. Процессы перепоглощения фотонов не рассматривались. Расчет форм выходных электрических импульсов (кривые 2 и 4 на рис. 1, b) был выполнен для условия идеального включения ФП в электрическую цепь.

На рис. 1, b представлены результаты измерения и расчета формы импульсов фотоответа отдельного p-i-n ТП ФП и модуля из двух подобных ТП ФП, соединенных последовательно. Кривые I (эксперимент) и 2 (расчет) относятся к p-i-n ТП ФП, а кривые 3 и 4 (эксперимент и расчет соответственно) — к модулю из двух ТП ФП при импульсной мощности лазерного излучения 4.7 W. Расчет выполнялся в соответствии с равенством

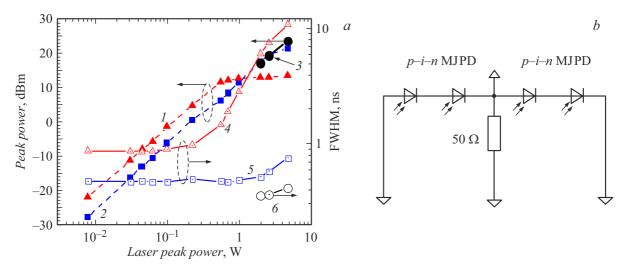


Рис. 2. a — зависимости выходной пиковой импульсной мощности (I-3) и длительностей импульсов на полувысоте амплитуды (4-6) для однопереходного p-i-n ФП (1,4), монолитного p-i-n ТП ФП (2,5) и модуля из двух p-i-n ТП ФП (3,6) от импульсной мощности лазерного излучения $(\lambda=850\,\mathrm{nm});\,b$ — электрическая схема модуля из четырех p-i-n ТП ФП.

фотогенерируемых токов в каждом из фотоактивных p-i-n-переходов [8]. Все измерения были выполнены на нагрузке $50\,\Omega$ осциллографом TDS7704B (Tektronix). Для p-i-n ТП ФП получено хорошее согласование форм экспериментальных и расчетных кривых импульсов фотоответа. Различия во временных параметрах и амплитуде импульса (рис. 1,b) для модуля из двух последовательно включенных ТП ФП можно объяснить неоднородностью плотности лазерного излучения на фронтальной поверхности ТП ФП, а также паразитными индуктивностями и емкостями монтажа p-i-n ТП ФП на микрополосковую линию.

Согласно полученным результатам, максимальная амплитуда фотоответа $(U_{\rm max})$, времена нарастания (τ_{rise}) и спада (τ_{fall}) на уровнях от 0.1 до 0.9 амплитуды и длительности электрического импульса на полувысоте амплитуды $(\tau_{0.5})$ составили соответственно: $U_{\rm max}=2.7~{\rm V}$, $\tau_{rise}=173~{\rm ps},~\tau_{fall}=1.28~{\rm ns},~\tau_{0.5}=750~{\rm ps}$ для одиночного ТП ФП и $U_{\rm max}=3.4~{\rm V},~\tau_{rise}=179~{\rm ps},~\tau_{fall}=430~{\rm ps},~\tau_{0.5}=420~{\rm ps}$ для модуля из двух последовательно включенных ТП ФП.

На рис. 2, a представлены экспериментальные зависимости выходной пиковой мощности (кривые 1-3) и длительности импульса фотоответа (кривые 4-6) для ТП ФП (кривые 2, 5) и модуля из двух ТП ФП (кривые 3, 6). Там же для сравнения приведены характеристики однопереходных ФП (ОП ФП) с диаметром мезы $250\,\mu$ m, полученных в том же МПЭ-режиме с аналогичным постростовым процессированием, при идентичном лазерном возбуждении ($\lambda=850\,\mathrm{nm}$) из оптоволокна (кривые 1, 4). Длительность импульса фотоответа на полувысоте амплитуды ТП ФП (кривая 5) при максимальной мощности лазерного излучения более чем на порядок меньше, чем у ОП ФП (кривая 4). Пиковая мощность ТП ФП (кривая 2) линейно растет в диапазоне

плотности мощности лазерного излучения ($\lambda=850\,\mathrm{nm}$) до $9.5\,\mathrm{kW/cm^2}$, в то время как для ОП ФП уже при плотности оптической мощности $\geq 1.0\,\mathrm{kW/cm^2}$ наступает насыщение (кривые I) и значение выходной пиковой мощности практически не изменяется. При мощности лазерного излучения $4.7\,\mathrm{W}$ значения выходной максимальной пиковой мощности P_{peak} составили $13.4\,\mathrm{dBm}$ для ОП ФП, $21.6\,\mathrm{dBm}$ для ТП ФП и $23.7\,\mathrm{dBm}$ для модуля из двух последовательно включенных ТП ФП.

Для эффективной работы РОФАР необходима генерация мощных биполярных импульсов. Показано, что СВЧ-модуль, состоящий из четырех p-i-n ТП ФП (рис. 2,b), при возбуждении лазерным излучением с пиковой мощностью до $10\,\mathrm{W}$ и задержкой между лазерными импульсами $\sim 500\,\mathrm{ps}$ [8–10] на сопротивлении нагрузки $50\,\Omega$ обеспечивает на выходе биполярный импульс с амплитудой $6.4\,\mathrm{V}$ (29.1 dBm) и длительностью $\tau_{0.5} \leq 1\,\mathrm{ns}$ (рис. 3,a). Частотная характеристика биполярного импульса по уровню $-3\,\mathrm{dB}$ имеет полосу пропускания до $1.4\,\mathrm{GHz}$ с основной несущей частотой $\sim 0.8\,\mathrm{GHz}$ (рис. 3,b).

Таким образом, в результате проведенных исследований впервые продемонстрирована в фотовольтаическом режиме генерация мощных субнаносекундных СВЧ-импульсов монолитными трехпереходными p-i-n AlGaAs/GaAs $\Phi\Pi$ и СВЧ-модулями на их основе.

Показано, что в трехпереходных p-i-n ФП по сравнению с однопереходными p-i-n ФП получено лучшее быстродействие с существенным увеличением выходной пиковой импульсной мощности:

— импульс фотоответа ТП ФП на нагрузке $50\,\Omega$ при пиковой мощности лазерного излучения $4.7\,\mathrm{W}$ ($\lambda=850\,\mathrm{nm},~\tau_{0.5}=140\,\mathrm{ps}$) составил $U_{\mathrm{max}}=2.7\,\mathrm{V},$ $\tau_{0.5}=750\,\mathrm{ps},~P_{peak}=21.6\,\mathrm{dBm}$ и $U_{\mathrm{max}}=3.4\,\mathrm{V},$

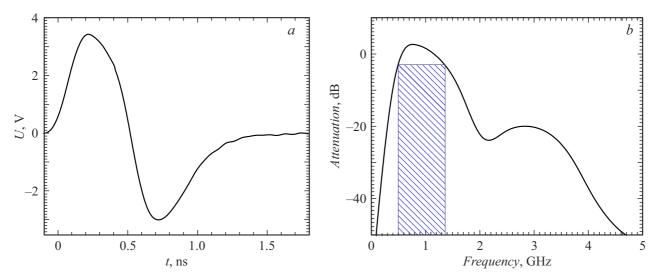


Рис. 3. a — биполярный импульс фотоответа оптоволоконного модуля из четырех p-i-n ТП ФП (Ø 250 μ m) на нагрузке $R_{load}=50~\Omega$ при возбуждении импульсным лазерным излучением ($\lambda=850~\mathrm{nm},~\tau_{0.5}\sim140~\mathrm{ps}$); b — частотная характеристика биполярного импульса фотоответа с выделенной полосой частот на уровне $-3~\mathrm{dB}$.

 $au_{0.5} = 420\,\mathrm{ps},\ P_{\it peak} = 23.7\,\mathrm{dBm}$ для модуля из двух ТП $\Phi\Pi$:

— модуль из четырех ТП ФП в фотовольтаическом режиме способен генерировать СВЧ-импульсы с амплитудой $6.4\,\mathrm{V}$ (29.1 dBm), длительностью $\tau_{0.5} \leq 1\,\mathrm{ns}$, полосой пропускания на уровне $-3\,\mathrm{dB}$ до $1.4\,\mathrm{GHz}$ и основной несущей частотой $\sim 0.8\,\mathrm{GHz}$.

Благодарности

Авторы выражают благодарность Г.В. Климко и С.В. Сорокину за изготовление эпитаксиальных структур методом МПЭ.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] Д.Ф. Зайцев, В.М. Андреев, И.А. Биленко, А.А. Березовский, П.Ю. Владиславский, Ю.Б. Гурфинкель, Л.И. Цветкова, В.С. Калиновский, Н.М. Кондратьев, В.Н. Косолобов, В.Ф. Курочкин, С.О. Слипченко, Н.В. Смирнов, Б.В. Яковлев, Радиотехника, **85** (4), 153 (2021). DOI: 10.18127/j00338486-202104-17
- [2] A. Rawat, M. Saif Islam, Proc. SPIE, 12880, 128800Q (2024).DOI: 10.1117/12.3003413
- [3] T. Long, Z. Xie, L. Li, L. Wang, X. Zou, H. Ji, J. Lu, B. Chen, J. Lightwave Technol., 42, 2042 (2024). DOI: 10.1109/JLT.2023.3328899
- [4] D. Maes, S. Lemey, G. Roelkens, M. Zaknoune, V. Avramovic, E. Okada, P. Szriftgiser, E. Peytavit, G. Ducournau, B. Kuyken, APL Photon., 8, 016104 (2023). DOI: 10.1063/5.0119244

- [5] Z. Xie, Z. Zhou, L. Li, Z. Deng, H. Ji, B. Chen, IEEE J. Sel.. Top. Quantum Electron., 28, 3801007 (2022). DOI: 10.1109/JSTQE.2021.3095470
- [6] Y. Peng, K. Sun, Y. Shen, A. Beling, J. C. Campbell, Opt. Express, 28 (19), 28563 (2020). DOI: 10.1364/OE.399102
- [7] Atlas User's Manual Device Simulation Software (Silvaco, 2015).
- V.S. Kalinovskiy, E.V. Kontrosh, G.A. Gusev, A.N. Sumarokov,
 G.V. Klimko, S.V. Ivanov, V.S. Yuferev, T.S. Tabarov,
 V.M. Andreev, J. Phys.: Conf. Ser., 993, 012029 (2018).
 DOI: 10.1088/1742-6596/993/1/01202
- [9] I.A. Tolkachev, E.V. Kontrosh, V.S. Kalinovsky, K.K. Prudchenko, G.V. Klimko, in *Proc. of 2024 Systems of signal synchronization, generating and processing in telecommunications (SYNCHROINFO)* (IEEE, 2024), p. 1–4. DOI: 10.1109/SYNCHROINFO61835.2024.10617448
- [10] V.S. Kalinovsky, E.V. Kontrosh, V.M. Andreev, A.V. Shamray, V.V. Lebedev, P.M. Arguzov, patent RU2789005C1 (2023).